## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年 5月18日現在

機関番号:12501
研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2008~2010
課題番号:20560317
研究課題名(和文) 弾性波可視化装置を利用した高機能弾性波動伝搬解析システムの構築
研究課題名(英文) Development of fast scanning laser probe system for RF acoustic wave devices.
研究代表者
大森 達也 (OMORI TATSUYA)
千葉大学・大学院工学研究科・助教
研究者番号:60302527

研究成果の概要(和文): 主に無線通信機に用いられるマイクロ波帯弾性波動デバイスにおけ る弾性波動の可視化について、実用的なシステムの構築、および、観察した可視化像のデータ 処理に関する検討を行った。この結果、圧電基板上を伝搬する弾性波動の振幅のみならず位相 についても、他の類似研究で発表されている装置に比して、極めて高速に可視化することに成 功した。この成果は高周波弾性波動デバイスの更なる研究・開発にとって有用であると考えら れる。

研究成果の概要(英文): This work aimed at development of high-speed laser probing system for RF acoustic wave devices. The newly developed system realized extremely fast data sampling by a skillfully applied delay compensation mechanism. It was also shown how the proposed system is effective in designing and analyzing SAW/BAW devices.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008年度	2, 500, 000	750, 000	3, 250, 000
2009年度	600, 000	180, 000	780, 000
2010年度	600, 000	180, 000	780, 000
年度			
年度			
総計	3, 700, 000	1, 110, 000	4, 810, 000

研究分野:工学

交付決定額

科研費の分科・細目:電気電子工学・電子デバイス・電子機器 キーワード:弾性波デバイス、可視化、計測、圧電応用

1. 研究開始当初の背景

表面弾性波(SAW)素子に代表される、弾性 波応用デバイスの開発において、圧電媒質中 を伝搬する弾性波の振舞いを直接観察する ことは、極めて重要であると考えられる。こ の要求に対して、著者の属するグループでは ナイフエッジ法、または、サニャック干渉計 を用いた高速弾性振動可視化装置について 検討してきた。これらは GHz 帯で動作して いる SAW 素子における弾性波伝搬の様子を 振幅のみならず位相も含めて測定すること を目標としている。 しかし、実用的な観察装置とするためには、 更なるサンプリング速度の向上、分かりやす いユーザーインターフェースの構築、測定デ ータの解析方法に関する検討などの課題が 残されていた。

2.研究の目的 これらの点を考慮し、本提案研究において は、次に挙げる二項目を大きな目的とした。

(1) より高速なデータサンプリングの実現と、 操作性の向上により、実用的な弾性振動可視 化装置を構築する。

具体的には、

①データサンプリング方法の改善における 更なる高速化

②高速化時に問題となる可視化像の乱れを 除去する手法の開発

③特に高周波素子の測定で問題となる試料 表面の傾き補正

(2) 可視化データを用いた波動伝搬解析の実例を示し、本システムの有効性を示す。

3. 研究の方法

(1) 実用的な可視化システム構築に向けた検討

 高速データサンプリング手法の確立と、 この過程で生じる信号遅延の補正を行う専 用ハードウェアの構築

本提案研究による弾性振動可視化装置は、 サニャック干渉計を用いて、弾性波の伝搬に ともなう圧電基板上の微小な凹凸を検出す る。この検出系は、基本的に低い周波数の振 動では感度が低く、高周波になるにつれて検 出感度が高くなる特徴を持つ。このため、測 定対象とする GHz 帯デバイス用に干渉計を 最適化すると、スキャンのためのステージ移 動や、測定者の移動などにより環境から受け る低い周波数の振動の影響をほとんど受け ることなく観察が可能となる。この事を利用 して、本可視化装置は、図 1 に示すように、 試料を乗せたステージに取り付けられた位 置測定用のリニアエンコーダから発するパ ルスをデータサンプリングのトリガとして 利用することで、ステージを自由走行(フリ ーラン)の状態にしたまま、データサンプリ ングを行うことができるようにする。

ところで、この際、ステージの往復両方向 の走査時ともデータサンプリングを行えば、 サンプリング速度を本質的に決定するのは ステージの移動速度のみとなり、ステージの 移動速度を同一とした場合に、もっとも無駄 の無いデータ取得が可能となる。しかし、実 際にこの方法でデータ取得を行うと、1 ライ ンの走査ごとにジグザグ状の位置ずれを生 じ、正常な可視化像とはならない。調査の結 果、この原因は検波回路において生じる遅延 により、サンプリングのためのトリガがデー タレコーダに到着した時に、その点の測定デ ータが、まだデータレコーダに到達していな いことによることが分かった。往復走査時に おいては、この観察点と実際に記録されるデ ータの間のズレの方向が1ラインごとに逆 方向になるために、大きな画質劣化の原因と なっている。

そこで、図2に示すように、リニアエンコ ーダからのパルスに対し、検波器で生じる遅 延時間に等しい遅延を生じさせる遅延回路



図1. 弾性波動可視化装置の構成

を挿入して、位置の補正を行うことを考えた。 なお、ここで用いる可視化装置では高感度に、 位相情報も含めて表面の微小変位を測定す るため、高周波ロックインアンプを検波機に 用いている。S/Nを向上するため、フィルタ を狭帯域にすると、ロックインアンプにおけ る遅延時間は数 100µs から数 ms と極めて大 きなものとなり、さらに、フィルタの時定数 を変更する度に遅延時間が変化するので、こ こでは、高速デュアルポートメモリを利用し たデジタル遅延回路を採用する。また、ロッ クインアンプのフィルタの時定数を変更す る度に、正確に遅延時間を調整することが必 要であることから、遅延回路における遅延時



図2. デジタル遅延回路を用いた遅延補正

間の変化がもたらす画質改善の度合いの評 価方法についても検討を行った。

② 観察試料表面の傾き補正

GHz 帯における高周波弾性波動の観察で は、一般に観察対象が微細になることから、 十分な空間分解能を実現するために、高倍率 の光学レンズを用いる必要がある。一般に高 倍率のレンズでは、被写界深度が浅いため、 観察対象表面の僅かな傾きにより、大きな感 度ムラを生じてしまう。この問題に対して、 本提案研究では、焦点位置をわずかずつ移動 させながら複数枚の可視化像を獲得し、これ らを合成することで、試料の傾きによる感度 差補正を試みた。この方法は、本可視化装置 のスキャン速度が非常に速いことを利用し ている。

4. 研究成果

(1) 高速弾性振動可視化システムの構築
 ① 超高速データサンプリングの実現と遅延
 時間補正による可視化像劣化の防止

提案方法にもとづき、XY ステージが 40 nm 移動するごとにリニアエンコーダが送出す るパルスを適宜分周した信号を、データ取得 のトリガパルスとして使用することで、ステ ージを自由走行させても、正しくデータ収集 できる可視化システムの構築に成功した。こ の可視化システムのデータサンプリング速 度は、一方向スキャン(自由走行させる時の 往路、または復路のみを使うスキャン)の場 合、およそ 0.7 kS/s であり、たとえば 1GHz 帯の共振子程度であれば、0.4 µm の十分な空 間分解能を保ったまま 8 分程度で測定が完了 する能力を持つ。

次に、メカニカルスキャン方式による極限 のデータサンプリング速度を実現するため、 自由走行させる場合の往復路ともデータ取 得に使う方法について検討した。往復両方向 に移動中、データサンプリングを行うと、前 述したとおり、主に検出機として用いている RF ロックインアンプの遅延のため、1 走査ご と逆方向に、サンプリング点のズレを生ずる。 図 3(a)は、電極周期1 µm の SAW 共振子の往 復走査による可視化像である。これによれば、 電極における光学的反射率の違いにより、電 極周期に一致する縦縞が観察されているが、 この縦縞が図 3(a)の拡大図に示すように、ジ グザグに変調されていることがわかる。これ が、遅延による影響である。

これに対し、サンプリングトリガを作る位置情報パルスを、検波回路における遅延時間と同じ時間だけ遅らせることで、画質劣化を 解消する手法を新たに考案した。図4に、このために設計・製作したデジタル遅延回路を示す。この遅延回路は、16 kBのデュアルポートメモリに1 µs ごとにパルス情報を書き込むため、0~約 16ms まで1 µs 刻みで遅延時間を可変できる能力を持つ。また、図4に示すように、遅延量を設定するための操作部を備え、メモリの読み込み・書き込み制御と



(0) 建建桶工设

図 3. 往復走査における SAW 可視化像

あわせ、3 個のマイクロプロセッサを用いて いる。

ところで、この方法において、遅延時間の 補正量は検波回路における遅延と正確に等 しくする必要がある。そのために、補正度合 いの客観的評価方法を提案した。図5は電極 周期  $p_{\rm I}$ の金属グレーティング中を伝搬する SAW を往復操作により可視化し、これを2次 元フーリエ変換したものである。これによれ ば、( $\pm 2\pi/p_{\rm I}$ , 0)の輝点に加えて( $\pm 2\pi/p_{\rm I}$ ,  $\pm 2\pi/2\Delta y$ )の4箇所に輝点が認められる。ここ



図 4. デジタル遅延回路

で、*Δy*は y 方向の刻み幅である。この4つの 輝点は、ジグザグ状のズレによるものなので、 これらの強度が最小となるよう遅延時間を 調整することにより補正量を決定する。図 6

$\left(-\frac{2\pi}{2p_1},\frac{2\pi}{2\Delta y}\right)$			$\left(\frac{2\pi}{2p_1}\right)$	$\left(\frac{2\pi}{2\Delta y}\right)$
	β <sub>y</sub>			
$\left(-\frac{2\pi^4}{2p_1},0\right)$	0	$\beta_x$	$\left(\frac{2\pi}{2p_1}\right)$	0)
$\left(-\frac{2\pi}{2p_1},-\frac{2\pi}{2\Delta y}\right)$			$\left(\frac{2\pi}{2p_1}\right)$	$-\frac{2\pi}{2\Delta y}$
h.				

図 5. 往復操作によって得られる、金属グレーティング 上を伝搬する SAW 可視化像の2次元 FFT 結果



図 6. 遅延時間に対するスプリアス輝点強度

がこれら輝点の強度と、遅延回路による遅延時間の関係である。これによれば遅延時間を 684 µs とすることで、最良の画像が得られる ことが分かる。この結果にもとづいて、遅延 回路を調整し、遅延補正を行った可視化像を 図 3(b) に示す。これにより、ジグザグ状の画像劣化が解消されていることが分かる。

この時、データサンプリング速度は 1.3 kS/s と、当初の目論見通り、一方向スキャン のほぼ倍となり、測定時間を半減することに 成功した。このサンプリング速度は、同種の 弾性波可視化装置と比べて、本研究遂行者の 知る限り、世界でも最高速である。

なお、これよりもさらにきめ細かい遅延時 間補正を行うために、より高速にメモリアク セスを可能とするよう CPLD を利用した遅延 回路(図 7)についても設計および作製を行っ た。

試料の傾き補正

本測定装置の高速性を生かし、わずかずつ 対物レンズの高さを変えながら、多数回の走 査・可視化を行い、これらを再合成すること で試料の傾きに起因する焦点ズレの影響を 補正する方法について検討を行った。このア ルゴリズムに基づいて、3GHz 帯で動作してい る弾性薄膜共振子の弾性波振動振幅を位相 まで含めて、明瞭に可視化することに成功し た。

最後に、開発した可視化システムを利用し



図 7. CPLD を用いた高分解能デジタル遅延回路

た SMR(Solidly Mounted Resonator)におけ る損失の解析について検討を行った結果に ついて述べる。具体的には反共振点における SMR からの弾性波動の漏洩について可視化 を行い、この結果と有限要素法による解析結 果を照合することで、損失発生のメカニズム に対する定量的な議論をすることに成功し た。

以上により、本提案研究において構築した 超高速かつ高機能な GHz 帯弾性振動可視化 システムの有用性が示された。

今後、観察対象表面の光反射係数の差によ る検出感度差の補正などを行い、更に弾性振 動振幅の絶対量評価などの改良・発展が期待 される。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線) 〔雑誌論文〕(計8件)

- K. Hashimoto, K. Kashiwa, N. Wu, <u>T.</u> <u>Omori</u>, M. Yamaguchi, O. Takano, S. Meguro, K. Akahane: "A laser probe based on a Sagnac interferometer with fast mechanical scan for RF surface and bulk acoustic wave devices", IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr, 58, 2011, pp. 187-194, 査読有
- ② F. Thalmayr, K. Hashimoto, M. Ueda, T. <u>Omori</u>, M. Yamaguchi: "Quantitative analysis of power leakage in an film bulk acoustic resonator device at antiresonance frequency", Japan Journal of applied physics, 49, 2010, pp. 07HD11-1 - 4, 査読有
- ③ N. Wu, K. Hashimoto, <u>T. Omori</u>, M. Yamaguchi: "A multiple-scan focusing method for radio-frequency bulk acoustic wave devices observation by laser probe system", Japan Journal of applied physics, 49, 2010, pp. 07HD10-1-4, 査読有
- ④ N. Wu, K. Hashimoto K. Kashiwa, <u>T.</u> <u>Omori</u>, M. Yamaguchi: "Integrated software for image processing in radio frequency surface and bulk acoustic wave laser probe system", Japan Journal of applied physics, 48, 2009, pp. 088002<sup>-1</sup> - 2, 査読有
- ⑤ N. Wu, K. Hashimoto, K. Kashiwa, <u>T.</u> <u>Omori</u>, M. Yamaguchi: "Focus adjustment system of laser robe for radio frequency surface and bulk acoustic wave devices", Japan Journal of applied physics, 48, 2009, pp. 108002-1-2, 査読有
- ⑥ 呉楠,柏景介,大森達也,橋本研也,山 口正恆:「弾性波可視化装置を用いた FBARにおけるエネルギー漏洩の解析」, 超音波テクノ,22,2009,pp.41-45,査 読無
- ⑦ <u>T. Omori</u>, K. Kashiwa, K. Hashimoto, M. Yamaguchi: "Time-delay compensation in detection electronics of fast scanning 2DSAW/BAW laser probe", Proc. 2009 IEEE Intl. Ultrasonics symp., 2009, pp. 1644 – 1647, 査読有
- ⑧ N. Wu, K. Hashimoto, K. Kashiwa, <u>T.</u> <u>Omori</u>, M. Yamaguchi: "Study on the frequency dependence of lateral energy leakage in RF BAW devices by fast-scanning laser probe system", Proc. 2008 IEEE Intl. Ultraonics symp., 2008, pp. 94 – 97, 査読有

〔学会発表〕(計3件)

- ① 巣山、島田、<u>大森</u>、橋本、山口:「広帯 域 SAW 共振子の導波路解析」,弾性波素 子技術第 150 委員会第 120 回研究会, 2011 年 1 月 25 日(東京)
- ② N. Wu, K. Hashimoto, K. Kashiwa, <u>T. Omori</u>, M. Yamaguchi: Recent progress in phase-sensitive and fast-scanning laser probe system for RF BAW/SAW laser probe", 4<sup>th</sup> Intl. Symp. On acoustics wave devices for future mobile communication systems, 2010 年 3 月 3 日 (千葉)
- ③ N. Wu, K. Hashimoto, K. Kashiwa, <u>T.</u> <u>Omori</u>, M. Yamaguchi: "Fast scanning laser probing system with graphic user interface for surface ad bulk acoustic wave devices", 2008 Joint Japan-USA international meeting on acoustic wave devices, 2008 年 12 月 10 日 (Florida, USA)
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者
  大森 達也 (OMORI TATSUYA)
  千葉大学・大学院工学研究科・助教
  研究者番号:60302527